# Politechnika Łódzka Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej

# Instrukcja do ćwiczenia

Obróbka statystyczna i wyznaczanie niepewności pomiarów wielkości elektrycznych

#### Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest poznanie rodzajów i metod wyznaczania niepewności pomiarów wielkości elektrycznych: napięcia, prądu i rezystancji na podstawie statystycznej obróbki wyników pomiarów.

#### Podstawy teoretyczne

Pomiar [3] jest to zbiór operacji mających na celu wyznaczenie wartości wielkości. Błąd pomiaru to różnica pomiędzy wynikiem pomiaru a wartością prawdziwą (rzeczywista) wielkości mierzonej. Wartość błędu pomiaru jest nieznana, ponieważ wartość prawdziwa wielkości (wartość zgodna z definicją określonej wielkości) jest ze względu na swoją naturę nieznana. Możemy zatem mówić tylko o niepewności pomiaru. **Niepewność pomiaru** jest parametrem związanym z wynikiem pomiaru, charakteryzującym rozrzut wartości, które można w uzasadniony sposób przypisać wielkości mierzonej [3]. Podany wynik pomiaru jest kompletny tylko wtedy, gdy zawiera zarówno wartość wielkości mierzonej, jak i **niepewność pomiaru**, związaną z tą wartością [1, 2]. Nieznaną wartość prawdziwą wielkości fizycznej najdokładniej można więc przedstawić, podając nie tylko wynik pomiaru ale przedział, w którym estymata tej wartości występuje z określonym **poziomem ufności** (czyli z określonym **prawdopodobieństwem** *p*). Poziom ufności jest miarą zaufania do wyznaczonego przedziału. Na wszystkie pomiary oddziałują różne czynniki między innymi:

- niedoskonałości przyrządów, wzorców i stałych fizycznych, wynikające m. in. ze skończonej rozdzielczości odczytu lub niezerowego progu pobudliwości przyrządów
- niedoskonałości metod pomiarowych wynikające z niedoskonałej definicji wielkości mierzonej, subiektywnych błędów w odczytywaniu wskazań przyrządów analogowych lub upraszczających założeń i przybliżeń stosowanych w metodach i procedurach pomiarowych
- otoczenie i zmienność warunków środowiska, przy czym mamy niepełną znajomość tego wpływu na obiekt pomiaru i aparaturę pomiarową.

Wymieniowe czynniki są źródłami **niepewności** pomiarów.

Do poprawnego oszacowania wielkości mierzonej niezbędne jest wykonanie nie tylko szeregu pomiarów, ale również ich prawidłowa obróbka statystyczna. Odpowiednia procedura postępowania prowadzi do otrzymania dwóch liczb:

- jednej, która według mierzącego najlepiej reprezentuje wartość prawdziwą wielkości mierzonej (tzw. estymatę punktową najczęściej wartość średnia  $\overline{X}$  z n pomiarów)
- oraz przypisanej do niej drugiej, która określa wartości graniczne(±U) przedziału, w którym z pewnym poziomem ufności (prawdopodobieństwem p) występuje ta wartość prawdziwa.

Należy pamiętać, żeby przed obliczeniem niepewności pomiarów usunąć błędy **nadmierne** i systematyczne.

W celu usunięcia **blędów nadmiernych** najczęściej stosuje się **kryterium 3s.** Polega ono na usunięciu ze zbioru pomiarów wszystkich wyników  $x_k$ , których błędy pozorne są większe lub równe trzem standardowym odchyleniom pojedynczego pomiaru:

$$|x_k - \overline{x}| \ge 3s(x) \tag{1}$$

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Na podstawie skumulowanej funkcji gęstości prawdopodobieństwa wyznacza się granice najmniejszego przedziału, odpowiadającego wymaganemu poziomowi ufności p. Granice są najczęściej symetryczne, oznaczane  $\pm U$ . Poziom ufności p w interpretacji geometrycznej jest to pole powierzchni pod funkcją gęstości prawdopodobieństwa, zawarte pomiędzy osią x i granicami oznaczającymi krańce przedziału niepewności, czyli od -U do +U.

gdzie dla 
$$n \ge 2$$
 wartość średnia

$$\bar{x} = \frac{\sum_{k=1}^{n} x_k}{n} \tag{2}$$

zaś odchylenie standardowe zmiennej losowej można określić za pomocą estymatora nieobciążonego ze wzoru:

$$s(x) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \cdot \sum_{k=1}^{n} (x_k - \overline{x})^2}$$
 (3)

Pomiary obarczone błędami nadmiernymi musimy odrzucić przed obliczaniem niepewności pomiarów.

**Blędy systematyczne o znanej wartości i znaku** usuwamy stosownie uwzględniając błędy wprowadzane przez przyrządy pomiarowe i metodę pomiaru, np.: błędu spowodowanego poborem mocy przez mierniki – metodą obliczeniową, błędu wywołanego siłami termoelektrycznymi – przez dwukrotny pomiar przy przeciwnych biegunowościach napięcia zasilającego itp.

Estymata wartości pomierzonej	Przedział niepewności	Poziom ufności	Przykład ogólny i interpretacja graficzna	Przykład
$\overline{X}$	U	p	$x = \overline{X} \pm U _{p}$ $-\overline{U} + \overline{X} + U$	$998,9\pm1,7 _{p=0,95}$
$\overline{X}$	U%	p	$\overline{X} \pm U \% _p$	$998,9 \pm 0,18  \% _{p=0,95}$
$\overline{X}$	U	p	$x \in \langle \overline{X} - U; \overline{X} + U \rangle  _{p}$	$x \in \langle 998, 9-1, 7; 998, 9+1, 7 \rangle \big _{p=0,95}$

Tabela 1. Sposoby zapisu wyniku pomiaru wielkości mierzonej X po usunięciu błędów systematycznych i nadmiernych.

Przedziały przedstawione w różny sposób w kolumnie 4 i 5 powyższej tabeli zawierają w sobie wartość prawdziwą wielkości mierzonej (jednej jedynej, stałej, nieznanej). Wartości w odróżnieniu od wielkości oznaczamy małymi literami. Przedział zależy od założonego **poziomu ufności** i **niepewności pomiarów** - jest wartością zmienną. **Najczęściej** stosowanym **poziomem ufności** jest **p=0,95**.

Źródłami niepewności pomiarów są:

- niedoskonałości definicji i realizacji modelu obiektu mierzonego,
- niedokładność przyrządów pomiarowych (dane producenta lub świadectwa kalibracji),
- błędy odczytu wskazań przyrządów, wynikające z niedoskonałości zmysłów obserwatora lub rozdzielczości urządzeń w torze pomiarowym,
- błędy odczytu wskazań przyrządów wynikające z pomyłek przy odczycie (często kwalifikowane jako błędy nadmiarowe "grube"),
- niedoskonałości metod pomiarowych,

- stosowanie przybliżonych wzorów i stałych fizycznych także obarczonych pewną niedokładnością, upraszczające założenia i przybliżenia stosowane w metodach i procedurach pomiarowych,
- niepełna wiedza o wpływie środowiska na obiekt pomiarowy i na przyrządy pomiarowe.

Wielkość	Liczba cyfr znaczących	Zasady zaokrąglania
Wynik pomiaru (estymata)	ma o jedną cyfrę znaczącą więcej niż pierwsza cyfra niepewna.	<ul> <li>taka sama liczba cyfr po przecinku, jak w niepewności pomiarowej</li> <li>jeżeli ostatnią cyfrą zaokrąglaną jest 0, 1, 2, 3, 4, to zaokrąglamy poprzednią cyfrę w dół,</li> <li>gdy ostatnią cyfrą zaokrąglaną jest 6, 7, 8, 9, to zaokrąglamy poprzednią cyfrę w górę.</li> <li>jeżeli ostatnią cyfrą zaokrąglaną jest cyfra 5, to zaokrąglamy poprzednią w górę, jeżeli po niej następuje na dowolnej pozycji jakakolwiek cyfra inna niż zero.</li> <li>jeżeli ostatnią cyfrą zaokrąglaną jest cyfra 5 i po niej występują same zera, to zaokrąglamy poprzednią w dół, jeśli jest ona parzysta.</li> <li>jeżeli ostatnią cyfrą zaokrąglaną jest cyfra 5 i po niej występują same zera, to zaokrąglamy poprzednią w górę, jeśli jest ona nieparzysta, do liczby parzystej.</li> </ul>
niepewność pomiaru	<ul> <li>ma o dwie cyfry znaczące więcej niż pierwsza cyfra niepewna</li> <li>wyjątkowo jedną cyfrę znaczącą, gdy zaokrąglenie nie spowoduje wzrostu niepewności o więcej niż 10%.</li> </ul>	zawsze w górę, aby nie obniżyć poziomu ufności w stosunku do wyniku niezaokrąglonego

Tabela 2. Zasady zaokrąglania wyników pomiaru i niepewności pomiaru.

#### Niepewność rozszerzoną U definiujemy według wzoru:

$$U = k_p \cdot u_C \tag{4}$$

gdzie  $k_p$  – jest współczynnikiem rozszerzenia zależnym od poziomu ufności p, a  $u_C$  – jest niepewnością łączną. Niepewności łączna jest sumą geometryczną niepewności A i B:

$$u_C = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} \tag{5}$$

• gdzie  $u_A$  – jest **niepewnością standardową typu A** obliczaną metodą statystyczną na podstawie wyników z serii pomiarów (obserwacji) zwaną metodą typu A. Jest niepewnością odpowiadającą błędom przypadkowym, zmieniającym się w sposób nieprzewidziany. Zalicza się do nich niepewności, powstające w wyniku niestałości parametrów układu pomiarowego, nieokreślonych zmian wielkości wpływających na pomiar oraz przypadkowych zmian wielkości mierzonych.

- u<sub>B</sub> jest niepewnością standardową typu B, wynikającą z danych technicznych aparaturowych, doświadczenia nabytego z wcześniej prowadzonych pomiarów oraz danych literaturowych. Niepewności tę oblicza się innymi metodami niż wynikającymi z metody typu A. Niepewności typu B odpowiadają błędom systematycznym o nieznanej wartości i znaku i są spowodowane:
  - o błędami narzędzi pomiarowych w znamionowych warunkach pracy,
  - o błędami narzędzi pomiarowych w warunkach pracy odmiennych od znamionowych,
  - o błędami wynikającymi z istnienia sprzężeń indukcyjnych, pojemnościowych i galwanicznych.

Jeśli błąd pomiaru traktujemy jako zmienną losową, to niepewność standardowa jest równa *odchyleniu standardowemu* σ tej zmiennej, a w przypadku serii wykonywanych pomiarów – odchyleniu standardowemu średniej s. Dzięki temu do obliczania niepewności pomiarów można stosować statystykę matematyczną i rachunek prawdopodobieństwa.

## Szacowanie niepewności typu A i B

**Niepewności typu A i B** nie można wyeliminować z wyniku pomiaru. Można jedynie oszacować ich wartości graniczne przy zadanym poziomie ufności **p**.

W statystyce rozrzut wartości średnich (2) jest nazywany **odchyleniem standardowym wartości średniej**  $s(\overline{x}_i)$ , a w teorii pomiaru nosi nazwę **niepewności standardowej typu A**  $u_A(\overline{x}_i)$ , gdzie i=1...N, N - liczba wielkości mierzonych.

Sposób oszacowania rozszerzonej niepewności typu A dla serii n pomiarów jednej wielkości (pomiar bezpośredni) lub dla serii po  $n_i$  pomiarów elementarnych dla N wielkości wejściowych (pomiar pośredni) gdy interesuje nas oszacowanie niepewności typu A wielkości wyjściowej oraz oszacowanie efektywnej liczby stopni swobody  $v_{eff}$  wypadkowego rozkładu t-Studenta i stosownych współczynników jest podany w suplemencie B, na końcu tej instrukcji.

# Zależności statystyczne przy obliczaniu niepewności standardowej pomiaru wielkości wejściowych

Zmienna losowa przyjmuje dowolne wartości z określonego zbioru i związany jest z nią założony rozkład prawdopodobieństwa. Wielkości mierzone – zarówno **wielkości wejściowe**  $X_i$  (i = 1, 2, ..., N) (w pomiarze bezpośrednim występuje tylko jedna wielkość, w pomiarze pośrednim, np. rezystancji metodą techniczną – dwie: prąd i napięcie), jak i **wielkość wyjściowa** (mezurand) Y – są zmiennymi losowymi, złożonymi z dwóch składników: wyniku pomiaru i błędu pomiaru

$$X_i = \overline{X}_i + \Delta X_i \tag{6}$$

$$Y = f(X_i) = \overline{Y} + \Delta Y \tag{7}$$

Pierwszy składnik jest wartością oczekiwaną. Dla wielkości wejściowych przyjmuje się, że **najlepszymi estymatami (oszacowaniami) ich wartości oczekiwanych** są **średnie arytmetyczne** z serii wyników pomiarów elementarnych (niezależnych statystycznie)  $x_{ik}$  ( $k = 1, 2, ..., n_i$ ) (wartości w odróżnieniu od wielkości oznaczamy małymi literami):

$$\overline{x}_{i} = \frac{1}{n_{i}} \sum_{k=1}^{n_{i}} x_{ik} = \frac{1}{n_{i}} (x_{i1} + x_{i1} + \dots + x_{in_{i}})$$
(8)

Drugi składnik  $\Delta X$ ,  $\Delta Y$  jest zmienną losową centrowaną, tzn. ma wartość średnią równą zero. Rozkład gęstości prawdopodobieństwa błędu  $\Delta X$ ,  $\Delta Y$  jest symetryczny względem zera. Rozkład ten jest określany przez podanie kształtu tego rozkładu gęstości prawdopodobieństwa, np. normalny, prostokątny, trójkątny, oraz wartości niepewności standardowej  $u(\bar{x}_i)$  lub błędu granicznego  $\Delta_g$ .

#### Obliczanie niepewności standardowej metodą typu A

Miarą rozrzutu pojedynczych wartości  $x_{ik}$  jest **odchylenie standardowe pojedynczego pomiaru** i, którego estymata wyrażona jest równaniem:

$$s(x_i) = \sqrt{\frac{1}{n_i - 1} \sum_{k=1}^{n_i} (x_{ik} - \overline{x}_i)^2} = \sqrt{\frac{1}{n_i - 1} [(x_{i1} - \overline{x}_i)^2 + (x_{i2} - \overline{x}_i)^2 + \dots + (x_{in_i} - \overline{x}_i)^2]}$$
(9)

(różnica  $\Delta x_{ik} = x_{ik} - \overline{x}_i$  jest zmienną losową centrowaną i nazywana jest **błędem pozornym**).

Gdybyśmy wykonali wiele serii  $n_i$  pomiarów i obliczyli wartość średnią  $\overline{x}_i$  każdej serii, to okazałoby się, że rozrzut wartości średnich każdej serii (każdej mierzonej wielkości)  $\overline{x}_i$  jest  $\sqrt{n_i}$  razy mniejszy od rozrzutu pojedynczych wartości  $x_{ik}$ . W statystyce taki rozrzut wartości średnich jest nazywany **odchyleniem standardowym wartości średniej**  $s(\overline{x}_i)$ , a w teorii pomiaru nosi nazwę **niepewności standardowej typu A**  $u_A(\overline{x}_i)$ . Ich estymata jest określona wzorem:

$$u_{A}(\overline{x}_{i}) = s(\overline{x}_{i}) = \frac{s(x_{i})}{\sqrt{n_{i}}} = \sqrt{\frac{1}{n_{i}(n_{i}-1)} \sum_{k=1}^{n_{i}} (x_{ik} - \overline{x}_{i})^{2}}$$
(10)

Niekiedy producent narzędzia pomiarowego podaje w dokumentacji wartość odchylenia standardowego  $s(x_i)$ , wyznaczoną na podstawie dobrze zdefiniowanego pomiaru, przeprowadzonego pod kontrolą statystyczną i złożonego z dużej liczby obserwacji. Wówczas do wzoru (10) wstawiamy tę wartość, zamiast wartości obliczonej ze wzoru (9).

W bardzo dokładnych obliczeniach niepewności pomiaru do wzoru (9) zamiast błędów pozornych podstawia się **błędy pozorne skorygowane**, w których wartość średnią zastępuje się wartościami **linii trendu**, jaki można wykryć w serii pomiarów, gdy na układ pomiarowy oddziałuje wielkość wpływająca o charakterze systematycznym.

#### Obliczanie niepewności standardowej metodą typu B

Niepewność standardowa typu B jest określana na podstawie informacji zawartych w specyfikacji przyrządu pomiarowego, w świadectwie wzorcowania lub w innych certyfikatach. Na podstawie powyższych danych szacuje się dla błędu  $\Delta X_i$  jego wartość graniczną  $\Delta_g$  i zakłada się kształt rozkładu gęstości prawdopodobieństwa  $\varphi(\Delta x_i)$  wystąpienia tego błędu. Jako niepewność standardową  $u_B(\overline{x_i})$  przyjmuje się odchylenie standardowe  $\sigma(x_i) = \sigma(\Delta x_i)$  (rozrzut wartości  $x_i$  wokół wartości średniej  $\overline{x_i}$  jest taki sam, jak rozrzut wartości błędu  $\Delta x_i$  wokół zera).

Graniczny (maksymalny) błąd pomiaru  $\Delta_g$  jest sumą błędu wskazań (składnik multiplikatywny) i błędu odczytu  $\Delta_{od}$  (np. w przypadku przyrządu wskazówkowego - zależnego od rozdzielczości oka ludzkiego, składnik addytywny). Zazwyczaj znaki tych błędów nie są znane, dlatego przyjmuje się zawsze skrajnie niekorzystny przypadek i sumuje ich wartości bezwzględne. Bezwzględny graniczny błąd pomiaru  $\Delta_g$  zależy od względnego maksymalnego błędu wskazań  $\delta_{max}$  pomnożonemu przez zakres pomiarowy  $\mathbf{Z}_p$ :

$$\Delta_g = \delta_{max} \cdot Z_p + \Delta_{od} \leqslant \frac{kl \cdot Z_p}{100\%} + \frac{wp \cdot Z_p}{d} \tag{11}$$

gdzie: kl – klasa przyrządu pomiarowego, wp – współczynnik charakteryzujący wprawę mierzącego miernikiem wskazówkowym, d – liczba działek podziałki miernika. Można przyjąć wp = 0,1 przy starannym odczytywaniu wskazań, czyli obserwator może się pomylić w oszacowaniu położenia wskazówki maksymalnie o 0,1 wartości, odpowiadającej odległości między sąsiednimi kreskami działowymi podziałki. Znormalizowane klasy przyrządu kl wynoszą: 0,05%, 0,1%, 0,2%, 0,5%, 1%, 1,5%, 2,5%, 5%.

Dla mierników cyfrowych brak jest jednolitego sposobu podawania przez wytwórców granicznych błędów charakteryzujących dokładność ich wyrobów (najczęściej podaje się też w postaci dwóch składników- multiplikatywnego i addytywnego). Różni wytwórcy podają w instrukcji miernika różne zależności, na podstawie których określa się błędy. Mogą one być różne dla poszczególnych

funkcji pomiarowych w ramach tego samego przyrządu. Wartości błędu granicznego są gwarantowane tylko w określonym czasie (np. 12 miesięcy), po upływie którego przyrząd powinien być ponownie poddany sprawdzeniu. Najczęściej stosuje się dwie metody wyznaczania błędu granicznego. W zależności od producenta błąd graniczny wyznacza się dwiema metodami. Pierwsza jako suma dwóch składowych: procentu wartości wskazanej x oraz procentu zakresu pomiarowego  $Z_x$ :

$$\Delta_{ar} x = (a\% x + b\% Z_x) \tag{12}$$

Wartości współczynników a i *b* są podane w dokumentacji dostarczonej przez producenta przyrządu. W drugim sposobie wyznaczania wykorzystywana jest wartość rozdzielczości przyrządu cyfrowego:

$$\Delta_{ar} x = (a\% x + n \cdot LSB) \tag{13}$$

Przez **rozdzielczość miernika cyfrowego** *LSB* (ang. least significant bit) należy rozumieć najmniejszą wartość wyświetlaną na danym zakresie pomiarowym, czyli jest najmniej znaczącą cyfrą na wyświetlaczu miernika. Najczęściej w przedziale pomiędzy wartościami granicznymi  $\langle -\Delta_g; +\Delta_g \rangle$  zakłada się r**ównomierny rozkład** gęstości prawdopodobieństwa, który ma kształt prostokąta o długości  $2\Delta_g$  i wysokości  $\varphi(\Delta x_i) = \frac{1}{2} \Delta_g$  (pole powierzchni każdego rozkładu musi się równać 1, gdyż prawdopodobieństwo znalezienia się błędu w przedziale  $\langle -\Delta_g; +\Delta_g \rangle$  wynosi 100%). Kwadrat odchylenia standardowego i niepewność standardową typu B obliczamy wówczas ze wzorów:

$$\sigma^{2}(\Delta x_{i}) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\Delta x_{i}) \cdot \Delta x_{i}^{2} d(\Delta x_{i}) = \int_{-\Delta_{g}}^{\Delta_{g}} \frac{1}{2\Delta_{g}} \Delta x_{i}^{2} d(\Delta x_{i}) = \frac{1}{2\Delta_{g}} \cdot \frac{\Delta x_{i}^{3}}{3} \Big|_{-\Delta_{g}}^{\Delta_{g}} = \frac{1}{2\Delta_{g}} \cdot \frac{\Delta_{g}^{3} - (-\Delta_{g})^{3}}{3} = \frac{\Delta_{g}^{2}}{3}$$

$$u_{B}(\overline{x}_{i}) = \sigma(\Delta x_{i}) = \frac{\Delta_{g}}{\sqrt{3}}$$

$$(14)$$

Jeżeli wiadomo, że wartości mierzonej wielkości znajdujące się w pobliżu środka przedziału zmienności są bardziej prawdopodobne niż wartości znajdujące się w pobliżu jej granic, to lepszym modelem będzie **rozkład trójkątny.** 

$$u_B(\bar{x}_i) = \frac{\Delta_g}{\sqrt{6}} \tag{15}$$

lub rozkład normalny

$$u_B(\bar{x}_i) = \frac{\Delta_g}{\sqrt{9}} \tag{16}$$

Natomiast gdy bardziej prawdopodobne są wartości znajdujące się w pobliżu granic, np. gdy wielkość zakłócająca ma przebieg sinusoidalny, to odpowiedniejszy będzie rozkład o **kształcie litery U**:

$$u_{\scriptscriptstyle B}(\overline{x}_i) = \frac{\Delta_g}{\sqrt{2}} \tag{17}$$

Typ rozkładu	Równomierny (prostokątny)	Trójkątny	Normalny (Gaussa)	W kształcie litery U
$u_{B}(\overline{x}_{i})$	$u_{B}(\overline{x}_{i}) = \sigma(\Delta x_{i}) = \frac{\Delta_{g}}{\sqrt{3}}$	$rac{\Delta_g}{\sqrt{6}}$	$\frac{\Delta_g}{\sqrt{9}}$	$\frac{\Delta_g}{\sqrt{2}}$

Tabela 3. Wartości niepewności typu B w zależności od typu rozkładu gęstości prawdopodobieństwa wartości mierzonej wielkości.

Niepewność standardowa pomiaru wielkości wejściowej  $X_i$  (niepewność łączna, nazywana dawniej niepewnością złożoną wielkości wejściowej) jest sumą geometryczną wszystkich składowych obliczonych metodą A i metodą B

$$u(\overline{x}_i) = \sqrt{u_A^2(\overline{x}_i) + u_B^2(\overline{x}_i)}$$
 (18)

Jeżeli na pomiar wielkości  $X_i$  wpływa kilka wielkości zakłócających, np. temperatura otoczenia, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność, pole elektromagnetyczne itp., to w powyższym wzorze wystąpi suma kilku - podniesionych do kwadratu - niepewności typu B.

#### Obliczanie niepewności standardowej pomiaru wielkości wyjściowej

Obliczanie niepewności standardowej pomiaru wielkości wyjściowej przedstawiono w suplemencie C. Podsumowując te rozważania można stwierdzić, że stosując **prawo propagacji niepewności**, otrzymuje się poszczególne udziały niepewności wielkości wejściowych w niepewności wielkości wyjściowej. Suma geometryczna tych udziałów jest nazywana **niepewnością standardową pomiaru wielkości wyjściowej** (dawniej nazywana niepewnością złożoną wielkości wyjściowej)

$$u(\overline{y}) = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} u_i^2(\overline{y})} = \sqrt{c_1^2[u_A^2(\overline{x}_1) + u_B^2(\overline{x}_1)] + \dots + c_N^2[u_A^2(\overline{x}_N) + u_B^2(\overline{x}_N)]}$$
(19)

gdzie  $c_i$ - jest odpowiednim współczynnikiem wrażliwości.

Powyższy wzór jest słuszny, jeżeli wielkości wejściowe są od siebie niezależne (nieskorelowane). W przeciwnym wypadku należy stosować wzory zawierające kowariancję lub współczynnik korelacji współzależnych wielkości wejściowych [3].

#### Metody uproszczonego obliczania niepewności pomiaru wielkości wyjściowej

W pomiarach przemysłowych stosuje się metody uproszczone, polegające na wykorzystaniu **współczynnika rozszerzenia**  $k_p$  (wzór (4)). Niepewność pomiaru wielkości wyjściowej  $U(\overline{y})$  oblicza się mnożąc niepewność standardową pomiaru wielkości wyjściowej  $u(\overline{y})$  przez ten współczynnik

$$U(\overline{y}) = k_p \cdot u(\overline{y}) \tag{20}$$

Wartość współczynnika  $k_p$  zależy od poziomu ufności p oraz od kształtu wypadkowej dystrybuanty, którego nie znamy. Przyjmuje się więc przybliżoną wartość tego współczynnika (zazwyczaj przyjmuje się p = 0.95). Wartości współczynnika rozszerzenia  $k_p$  dla różnych rozkładów gęstości prawdopodobieństwa podano w tabeli 4.

Typ rozkładu	Symbol	Wartość*
w kształcie litery U	$k_U$	1,410
prostokątny	$k_R$	1,645
trójkątny	$k_T$	1,902
normalny	$k_N$	1,960
t-Studenta o 1 stopniu swobody	$k_{S,I}$	12,71

<sup>\*-</sup> sposób obliczenia wartości  $k_p$  podano w suplemencie B na końcu instrukcji.

Tabela 4. Wartości współczynnika rozszerzenia  $k_p$  dla poziomu ufności p = 0.95 dla różnych rozkładów gęstości prawdopodobieństwa.

р	0,5	0,683	0,95	0,99	0,997	0,999
$k_p$	0,676	1	1,96	2,58	2,97	3,29

Tabela 5. Współczynniki rozszerzenia  $\mathbf{k}_p$  dla rozkładu Gaussa dla wybranych poziomów ufności

v	2	3	5	7	8	9	10	20	30	50	100	$\infty$
$k_{0,95;v}$	4,30	3,18	2,57	2,36	2,31	2,26	2,23	2,09	2,04	2,01	1,984	1,960

Tabela 6. Współczynniki rozszerzenia dla  $\mathbf{p} = 0.95 \ \mathbf{k}_{0.95;v}$  dla rozkładu t-Studenta, przy  $\mathbf{v}$  stopniach swobody ( $\mathbf{v}$  pomiarach)

### Odchylenie standardowe w pomiarach złożonych

Dla pomiarów pośrednich, czyli takich w których wynik jest rezultatem operacji matematycznych na wynikach pomiarów bezpośrednich, np.  $R = \frac{U}{I}$ , stosuje się matematyczną zależność obliczania niepewności standardowej jako odchylenia standardowego funkcji złożonej zgodnie z teorią rachunku prawdopodobieństwa:

$$u^{2} = \left(\frac{\partial f(X_{1}, X_{2}, \dots X_{n})}{\partial X_{1}}\right)^{2} \cdot u_{X_{1}}^{2} + \left(\frac{\partial f(X_{1}, X_{2}, \dots X_{n})}{\partial X_{2}}\right)^{2} \cdot u_{X_{2}}^{2} + \dots + \left(\frac{\partial f(X_{1}, X_{2}, \dots X_{n})}{\partial X_{n}}\right)^{2} \cdot u_{X_{n}}^{2} + \dots + \left(\frac{\partial f^{2}(X_{1}, X_{2}, \dots X_{n})}{\partial X_{1} \partial X_{2}}\right)^{2} \cdot u_{X_{1}X_{2}}^{2} + \dots$$

$$+ \left(\frac{\partial f^{2}(X_{1}, X_{2}, \dots X_{n})}{\partial X_{1} \partial X_{2}}\right)^{2} \cdot u_{X_{1}X_{2}}^{2} + \dots$$

$$(21)$$

$$u^{2} = (c_{x_{1}})^{2} \cdot u_{x_{1}}^{2} + (c_{x_{2}})^{2} \cdot u_{x_{2}}^{2} + \dots + (c_{x_{n}})^{2} \cdot u_{x_{1}n}^{2} + (c_{x_{1},x_{2}})^{2} \cdot u_{x_{1},x_{2}\dots}^{2}$$
(22)

gdzie współczynniki

$$c_{X_i} = \frac{\partial f(X_1, X_2, \dots X_n)}{\partial X_i}$$
, ...,  $c_{X_i, X_j} = \frac{\partial f^2(X_1, X_2, \dots X_n)}{\partial X_{i,j}}$  są współczynnikami wrażliwości.

<u>Uwaga praktyczna</u>: dla uproszczenia, gdy funkcja gęstości prawdopodobieństwa jest zbliżona do rozkładu Gaussa, to do obliczenia niepewności rozszerzonej U na poziomie ufności p = 0,95 można stosować współczynnik rozszerzenia  $k_p = 2$  i wówczas  $U = 2u_c$ .

Obliczenie niepewności standardowej pomiaru rezystancji metodą pośrednią zamieszczono w opisie części wykonawczej ćwiczenia.

Niepewność rozszerzoną oblicza się ze wzoru (22):

$$U_p = k u_c \tag{23}$$

w którym współczynnik rozszerzenia jest zmienną zależną od rozkładu łącznego niepewności obliczanej metodą typu A i typu B, a  $u_c = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$  jest niepewnością standardową łączną.

Jeżeli w niepewności łącznej  $u_c$  dominującym jest rozkład typu A, a ten jest rozkładem zbliżonym do rozkładu Gaussa lub t-Studenta stosuje się współczynniki rozszerzenia, odpowiadające tym rozkładom (Tabele 5 i 6). Jeżeli dominującym jest rozkład jednostajny (prostokątny), wówczas stosuje się zależność:

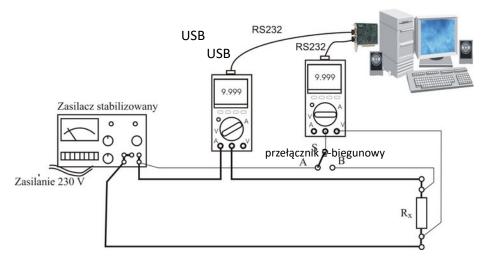
$$k_p = p\sqrt{3} \tag{24}$$

Jeżeli żaden powyższych przypadków nie występuje, wówczas dla poziomu ufności p = 0.95 można przyjąć, że  $k_{p=0.95} = 2$ , ale należy pamiętać, że jest to oszacowanie tylko przybliżone.

# Wykonanie ćwiczenia i przykłady obliczeń

#### A. Szacowanie niepewności metodą typu B

1. Połączyć układ pomiarowy zgodnie ze schematem na rys. 1.



#### Wykonanie ćwiczenia

#### Wykaz aparatury:

Rezystor wzorcowy  $1 \text{ k}\Omega$ , 2 multimetry cyfrowe (miliamperomierz + woltomierz), zasilacz stabilizowany napięcia stałego.

W ćwiczeniu wykonuje się pomiar rezystancji metodą pośrednią oraz oblicza się niepewność wyniku pomiaru korzystając z metody typu A i metody typu B, zgodnie z międzynarodowym przewodnikiem GUM (Głównego Urzędu Miar) - "Guide to the expression of uncertainty in measurement, (GUM) JCGM OIML" 2020 i poniższej instrukcji.

Liczba pomiarów	$U_{ m V}$	I	$R = \frac{U}{I}$	$u_{BRrel} = \sqrt{u_{BUrel}^2 + u_{BIrel}^2}$	$u_{BRx} = U_{BRrel} \cdot R$	$U_{BRx} = k \cdot u_{BRx}$
	V	A	Ω	%	Ω	Ω
1						
30						
100						
500						
1000						
Liczba pon	iiarów	7 Z	Zapis wyni	$\overline{\text{k\'ow pomiaru } R_x \pm U_{BRx}}$	[Ω]	,
1						
30						
100	100					
500						
1000						

Dane techniczne dotyczące błędów granicznych przyrządów pomiarowych zamieszczono w instrukcji do przyrządów.

Obliczenia dla liczby pomiarów  $\geq 30$  należy wykonać w arkuszu kalkulacyjnym korzystając z

zaimplementowanych formuł. Obliczenia dla pojedynczego pomiaru należy wykonać samodzielnie zgodnie z poniższym schematem.

#### Obliczenia niepewności standardowej pomiaru rezystancji metodą pośrednią

Wartość rezystancji mierzonej metodą techniczną oblicza się z zależności:

$$R = \frac{U_V}{I} \tag{25}$$

W celu obliczenia niepewności standardowej pośredniego pomiaru rezystancji stosuje się zależności (21) i (22). Rezystancja jest funkcją napięcia *U* oraz prądu *I*, więc:

$$\frac{\partial R}{\partial U_{V}} = \frac{1}{I}, \quad oraz \quad \frac{\partial R}{\partial I} = U_{V} \cdot \left(\frac{-1}{I^{2}}\right)$$
 (26)

Na tej podstawie:

$$u_{Bc}^{2}(R) = \left(\frac{\partial f(R)}{\partial U_{V}}\right)^{2} \cdot u_{BU}^{2} + \left(\frac{\partial f(R)}{\partial I}\right)^{2} \cdot u_{BI}^{2}$$
(27)

Zastępując wyrażenia w nawiasach tzw. współczynnikami czułości  $c_i$  równanie przyjmuje postać:

$$u_{Bc}^{2}(R) = (c_{U})^{2} \cdot u_{BU}^{2} + (c_{I})^{2} \cdot u_{BI}^{2}$$
(28)

Współczynniki czułości dla napięcia i prądu oblicza się z następujących zależności:

$$c_{U} = \frac{\partial f(R)}{\partial U_{V}} = \frac{1}{I}$$

$$c_{I} = \frac{\partial f(R)}{\partial I} = U_{V} \left( \frac{-1}{I^{2}} \right) = \frac{-U_{V}}{I^{2}}$$
(29)

Wstawiając współczynniki czułości do równania (27) otrzymuje się końcowy wzór do obliczenia niepewności typu B w pomiarze pośrednim rezystancji:

$$u_{Bc}^{2}(R) = \left(\frac{1}{I}\right)^{2} \cdot u_{BU}^{2} + \left(\frac{-U_{V}}{I^{2}}\right)^{2} \cdot u_{BI}^{2}$$
(30)

Po podzieleniu zależności (30) stronami przez równanie (25) otrzymuje się równanie w jednostkach względnych postaci:

$$u_{Bcrel}^{2}(R) = \frac{u_{Bc}^{2}(R)}{R^{2}} = \frac{\left(\frac{1}{I}\right)^{2} \cdot u_{BU}^{2}}{R^{2}} + \frac{\left(\frac{-U_{V}}{I^{2}}\right)^{2} \cdot u_{BI}^{2}}{R^{2}}, \text{ po przekształceniu ostatecznie niepewność w}$$

jednostkach względnych przyjmuje postać:

$$u_{Bcrel}^{2}(R) = \frac{u_{Bc}^{2}(R)}{R^{2}} = \frac{\left(\frac{1}{I}\right)^{2} \cdot u_{BU}^{2}}{\left(\frac{U_{V}}{I}\right)^{2}} + \frac{\left(\frac{-U_{V}}{I^{2}}\right)^{2} \cdot u_{BI}^{2}}{\left(\frac{U_{V}}{I}\right)^{2}} = \frac{u_{BU}^{2}}{U_{V}^{2}} + \frac{u_{BI}^{2}}{I^{2}} = u_{BUrel}^{2} + u_{BIrel}^{2}$$
(31)

Ostatecznie niepewność typu B przedstawiona w j<u>ednostkach</u> względnych wynosi:

$$u_{Bcrel}(R) = \sqrt{u_{BUrel}^2 + u_{BIrel}^2}$$
 (32)

Znając wartość względną niepewności standardowej łącznej w pomiarze pośrednim dla niepewności wyznaczonej metodą typu B:

$$u_{BUrel} = \frac{\Delta_{gr} U_V}{\sqrt{3} \cdot U_V}; \qquad u_{BIrel} = \frac{\Delta_{gr} I}{\sqrt{3} \cdot I}$$
 (33)

Niepewność standardowa typu B wynosi:

$$u_{Bc} = u_{Bcrel} \cdot R \tag{34}$$

Współczynnik rozszerzenia  $k_p$  jest uzależniony od wypadkowego rozkładu niepewności typu A i typu B lub tylko A lub B, jeżeli występuje tylko jeden z nich.

Dla rozkładu jednostajnego (prostokątnego) dla p poziomu ufności współczynnik  $k_p$  wyraża się

zależnością:

$$k_p = p\sqrt{3}$$
dla  $p \in \langle 0; 1 \rangle$  przykładowo:  $k_{0,95} = 0,95 \cdot \sqrt{3}$ 

W przypadku dwóch rozkładów prostokątnych rozkładem łącznym jest rozkład trapezowy, a jego szczególnym przypadkiem jest rozkład trójkątny.

W przypadku, gdy oprócz niepewności typu B występuje niepewność typu A, wówczas ich łączna niepewność standardowa wyraża się zależnością (5), a niepewność rozszerzona wzorem (4), gdzie  $k_p$  jest zmienną zależną od rozkładu, łączącego niepewności obliczane metodą typu A i typu B.

## Suplement A

# Metody obliczania niepewności pomiarów i przykłady obróbki statystycznej

**Przykłady** 

1) Jeżeli funkcja pomiaru f jest sumą lub różnicą wielkości wejściowych  $X_i$ 

$$f(X_1, X_2, ..., X_N) = \sum_{i=1}^{N} a_i X_i = a_1 X_1 + a_2 X_2 + ... + a_N X_N$$
(35)

to, zgodnie z równaniem (8), estymata wielkości wyjściowej jest odpowiednią sumą lub różnicą estymat wielkości wejściowych

$$\bar{y} = \sum_{i=1}^{N} a_i \bar{x}_i = a_1 \bar{x}_1 + a_2 \bar{x}_2 + \dots + a_N \bar{x}_N$$
(36)

natomiast współczynniki wrażliwości są wtedy równe  $a_i$  i równanie (19) na  $u(\bar{y})$  przyjmuje postać

$$u(\bar{y}) = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} a_i^2 u^2(\bar{x}_i)} = \sqrt{a_1^2 u^2(\bar{x}_1) + a_2^2 u^2(\bar{x}_2) + \dots + a_N^2 u^2(\bar{x}_N)}$$
(37)

2) Jeżeli funkcja pomiaru f jest iloczynem lub ilorazem wielkości wejściowych  $X_i$ 

$$f(X_1, X_2, ..., X_N) = a_0 \prod_{i=1}^N X_i^{a_i} = a_0 \cdot X_1^{a_1} \cdot X_2^{a_2} \cdot ... \cdot X_N^{a_N}$$
(38)

to również estymata wielkości wyjściowej jest odpowiednim iloczynem lub ilorazem estymat wielkości wejściowych

$$\bar{y} = a_0 \prod_{i=1}^{N} \bar{x}_i^{a_i} = a_0 \cdot \bar{x}_1^{a_1} \cdot \bar{x}_2^{a_2} \cdot \dots \cdot \bar{x}_N^{a_N}$$
(39)

W tym wypadku współczynniki wrażliwości są równe

$$\frac{\partial f}{\partial X_{i} X_{i} = \bar{x}_{i}} = a_{0} \cdot a_{i} \cdot X_{i}^{a_{i}-1} \prod_{j=1; j \neq i}^{N} X_{j}^{a_{j}} \Big|_{X_{i} = \bar{x}_{i}} = \frac{a_{i}}{X_{i}} a_{0} \prod_{j=1}^{N} X_{j}^{a_{j}} \Big|_{X_{i} = \bar{x}_{i}} = \frac{a_{i}}{X_{i}} Y \Big|_{X_{i} = \bar{x}_{i}} = \frac{a_{i}}{\bar{x}_{i}} \bar{y}$$

$$(40)$$

i przy zastosowaniu względnych niepewności standardowych:

$$u_{\text{rel}}(\bar{y}) = \frac{u(\bar{y})}{\bar{y}}$$
 oraz  $u_{\text{rel}}(\bar{x}_i) = \frac{u(\bar{x}_i)}{\bar{x}_i}$ 

otrzymuje się analogiczną sumę geometryczną, jak we wzorze (26)

$$u_{\text{rel}}(\bar{y}) = \frac{u(\bar{y})}{\bar{y}} = \frac{1}{\bar{y}} \sqrt{\sum_{i=1}^{N} \left[ \frac{a_i}{\bar{x}_i} \bar{y} \cdot u(\bar{x}_i) \right]^2} = \sqrt{\frac{1}{\bar{y}^2} \sum_{i=1}^{N} \bar{y}^2 \left[ a_i \frac{u(\bar{x}_i)}{\bar{x}_i} \right]^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} a_i^2 u_{\text{rel}}^2(\bar{x}_i)}$$
(41)

Jeżeli wykładniki potęg  $a_i$  we wzorze (38) równają się +1 lub -1, to przy obliczaniu względnej niepewności standardowej można pominąć współczynniki wrażliwości.

#### Obliczanie niepewności pomiaru wielkości wyjściowej

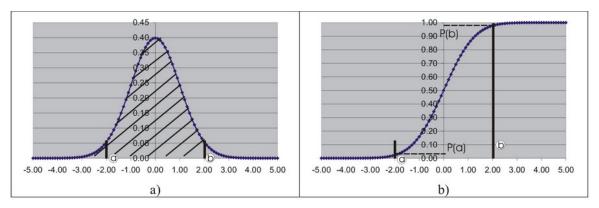
W celu obliczenia niepewności wielkości <u>wyjściowej</u>  $U(\bar{y})$  czyli niepewności rozszerzonej, należy wyznaczyć rozkład gęstości prawdopodobieństwa błędu wielkości wyjściowej. Rozkład ten jest splotem rozkładów gęstości prawdopodobieństwa błędu wszystkich udziałów wielkości wejściowych  $u_i(\bar{y})$ . Musimy zatem znać parametry tych rozkładów.

W przypadku **niepewności typu A** przyjmuje się, że rozkład gęstości prawdopodobieństwa błędu jest **rozkładem normalnym**, którego odchylenie standardowe równa się estymacie  $s(\bar{x}_i)$ , obliczonej ze wzoru (9), pomnożonej przez współczynnik wrażliwości  $c_i$ . Estymata  $s(\bar{x}_i)$  ma wartość zbliżoną do rzeczywistej wartości odchylenia standardowego wtedy, gdy liczba pomiarów elementarnych jest bardzo duża. W miarę zmniejszenia liczby pomiarów oszacowanie wartości  $s(\bar{x}_i)$  jest obarczane coraz większym błędem. Oszacowanie wartości tego błędu, który podlega

rozkładowi  $\chi^2$ , jest uwzględnione w rozkładzie t-Studenta. Dlatego w wypadku niewielkiej liczby pomiarów elementarnych,  $n_i \le 30$ , zamiast rozkładu normalnego należy stosować rozkład t-Studenta, którego kształt zależy nie tylko od wartości  $s(\bar{x}_i)$ , ale również od liczby stopni swobody  $v_i = n_i - 1$ , czyli od liczby pomiarów.

W przypadku niepewności typu B przyjmuje się, że rozkład gęstości prawdopodobieństwa błędu jest jednym z rozkładów: równomiernym, trójkątnym, trapezowym, w kształcie litery U lub normalnym, o określonej wartości błędu granicznego  $\Delta_g$ .

Z centralnego twierdzenia granicznego wynika, że im więcej rozkładów zostanie splecionych, tym bardziej splot wypadkowy będzie zbliżony do rozkładu normalnego (nawet, jeżeli są to rozkłady U-kształtne). Z wykresu gęstości prawdopodobieństwa wypadkowego splotu można określić prawdopodobieństwo P wystąpienia błędu w zadanym przedziale – jest ono całką funkcji gęstości w tym przedziale, np. dla rozkładu normalnego (rys. 1a) w przedziale  $\langle -\sigma; +\sigma \rangle$  P = 68,27%, w przedziale  $\langle -2\sigma; +2\sigma \rangle$  P = 95,45%, w przedziale  $\langle -3\sigma; +3\sigma \rangle$  P = 99,73%.



Rys. 1. Funkcja gęstości prawdopodobieństwa błędu (a) oraz dystrybuanta (b) dla standaryzowanego rozkładu normalnego ( $\bar{x}=0$ ,  $\sigma=1$ ). Błędy na osi odciętych są wyskalowane w wartościach odchylenia standardowego.

W celu wyznaczenia przedziału, w którym prawdopodobieństwo wystąpienia błędu ma określoną wartość P, wygodniej jest korzystać z **dystrybuanty**, która jest całką gęstości prawdopodobieństwa w granicach od  $-\infty$  do bieżącej wartości  $\Delta x_i$  (rys. 1b). Wtedy prawdopodobieństwo wystąpienia błędu w przedziale  $\langle a; b \rangle$  równa się różnicy prawdopodobieństw P(b) - P(a). Jeżeli przedział  $\langle a; b \rangle$  ma być szukanym przedziałem ufności $\langle -U; +U \rangle$ , to różnica P(b) - P(a) powinna się równać poziomowi ufności p = 0.95. Z symetrii dystrybuanty względem punktu (0; 0.5) wynika, że P(b) + P(a) = 1. Rozwiązując układ dwóch równań otrzymamy  $P(a) = \frac{1}{2}(1-p) = 0.025$ ,  $P(b) = \frac{1}{2}(1+p) = 0.975$ . Znając wartość P(b), możemy z wykresu dystrybuanty odczytać górną granice przedziału ufności, czyli wartość niepewności pomiaru wielkości wyjściowej  $U(\bar{y})$ .

## Suplement B

#### Sposób obliczenia wartości współczynnika rozszerzenia k, w zależności od typu rozkładu gęstości prawdopodobieństwa

- 1. W przypadku wyznaczania tylko niepewności typu B i wykonania pomiarów jeden raz rozkład błędów jest prostokatny. Stosujemy wtedy następujące wzory:
  - 1. Gdy mierzymy jedną wielkość (pomiar bezpośredni)

$$u(y) = u_B(y) = \frac{\Delta_g}{\sqrt{3}}; \quad k_R = p\sqrt{3} = 0.95\sqrt{3} = 1.645$$

$$U(y) = U_B(y) = k_R u_B(y) = 0.95\Delta_g$$
(42)

2. Gdy mierzymy dwie wielkości wejściowe (pomiar pośredni)

$$u(y) = \sqrt{[c_1 u_B(x_1)]^2 + [c_2 u_B(x_2)]^2} = \sqrt{\frac{1}{3}[(c_1 \Delta_{g1})^2 + (c_2 \Delta_{g2})^2]},$$
(43)

gdzie  $c_i$  są współczynnikami wrażliwości wielkości wyjściowej na wielkości wejściowe - obie o rozkładach prostokątnych. Splot tych dwóch rozkładów prostokątnych ma kształt trapezu, dla którego współczynnik rozszerzenia k równa się:

$$k_{2R} = \sqrt{3} \frac{1 + \beta - 2\sqrt{\beta(1-p)}}{\sqrt{1+\beta^2}} \text{gdzie } \beta = \frac{|c_2 u_B(x_2)|}{|c_1 u_B(x_1)|}$$
(44)

Jeśli oba rozkłady prostokątne są jednakowe ( $\beta$ = 1), to ich splot ma kształt trójkąta i współczynnik rozszerzenia wynosi wówczas:

$$k_T = \sqrt{6}(1 - \sqrt{1 - p}) = 1,902$$
 (45)

Z wykresu  $k_{2R} = f(\beta, 0)$  przedstawionego na rys. 2 wynika, że ten współczynnik **k** może przyjmować wartości z przedziału (1,643; 1,902).

3. Gdy mierzymy trzy lub więcej wielkości wejściowych

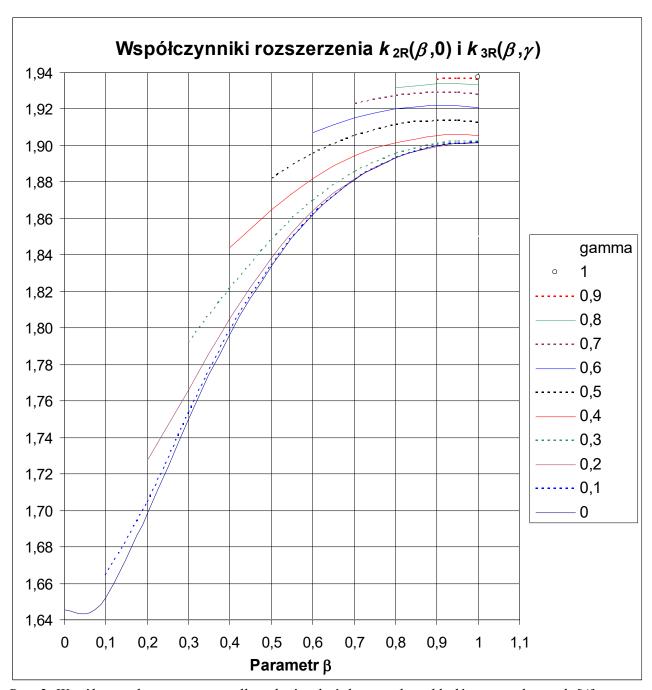
$$u(y) = \sqrt{[c_1 u_B(x_1)]^2 + [c_2 u_B(x_2)]^2 + \dots + [c_N u_B(x_N)]^2}$$
(46)

Dla trzech wielkości wejściowych współczynnik  $k_{3R}$  możemy odczytać z wykresu na rys. 2, gdzie parametr y został określony zależnością

$$\gamma = \frac{|c_3 u_B(x_3)|}{|c_1 u_B(x_1)|} \text{ przy założeniu, że } |c_1 u_B(x_1)| \ge |c_2 u_B(x_2)| \ge |c_3 u_B(x_3)| \tag{47}$$

Dla trzech lub większej liczby wielkości wejściowych możemy zastosować wzór 
$$k_{\text{Rwyp}} = 1,95-2,44 \, e^{-2,33 \, w}$$
, gdzie  $w = \left(\frac{u(y)}{\max |c_i u_B(x_i)|}\right)^2$  (48)

zapewniający obliczenie k z dokładnością 1%. Jeżeli zadowala nas mniejsza dokładność obliczenia niepewności, to możemy przyjąć proponowaną przez "Guide" [1] wartość k = 2. Wtedy błąd oszacowania niepewności może dojść – przy małej liczbie N – do +15%.



Rys. 2. Współczynniki rozszerzenia dla splotów dwóch i trzech rozkładów prostokątnych [4]

#### Uwzględnianie tylko niepewności typu A

1. Jeżeli wykonujemy serię *n* pomiarów jednej wielkości (pomiar bezpośredni) i interesuje nas oszacowanie jej niepewności tylko typu A, to stosujemy wzory

$$u_{A}(\bar{y}) = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)}} \sum_{k=1}^{n} (y_{k} - \bar{y})^{2} ; k_{S} = k_{S}(v) = t_{0.95;v} ; U(\bar{y}) = U_{A}(\bar{y}) = k_{S} u_{A}(\bar{y})$$

$$(49)$$

gdzie współczynnik Studenta  $t_{0,95;\nu}$  odczytujemy z poniższej tabeli:

v=n-1	1	2	3	4	5	9	14	19	29	49	99	$\infty$
$t_{0,95;\nu}$	12,71	4,30	3,18	2,78	2,57	2,26	2,14	2,09	2,04	2,01	1,98	$k_{\rm N}$ = 1,96

2. Jeżeli wykonujemy serie po  $n_i$  pomiarów elementarnych dla N wielkości wejściowych (pomiar pośredni) i interesuje nas oszacowanie niepewności typu A wielkości wyjściowej y, to stosujemy wzory:

$$u_{A}(\bar{x}_{i}) = \sqrt{\frac{1}{n_{i}(n_{i}-1)} \sum_{k=1}^{n_{i}} (x_{ik} - \bar{x}_{i})^{2}}; \quad u_{A}(\bar{y}) = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} [c_{i}u_{A}(\bar{x}_{i})]^{2}}; \quad k_{\text{Swyp}} = t_{0.95; v_{eff}};$$

$$U_{A}(\bar{y}) = k_{\text{Swyp}} u_{A}(\bar{y})$$
(50)

gdzie efektywną liczbę stopni swobody  $v_{eff}$  wypadkowego rozkładu t-Studenta obliczamy ze wzoru Welcha-Satterthwaite'a (wynik zaokrąglamy w dół do liczby całkowitej)

$$v_{eff} = \frac{u_A^4(\bar{y})}{\sum_{i=1}^N \frac{1}{v_i} [c_i u_A(\bar{x}_i)]^4}$$
 (51)

#### Uwzględnianie niepewności typu A i B

1. Jeżeli wykonujemy serię *n* pomiarów jednej wielkości (pomiar bezpośredni) i uwzględniamy zarówno niepewności standardowe typu A o rozkładzie t-Studenta, jak i typu B o rozkładzie prostokątnym, to stosujemy wzór:

 $U(\bar{y}) = k_{SR} \sqrt{u_A^2(\bar{y}) + u_B^2(\bar{y})}$  (52)

gdzie współczynnik rozszerzenia  $k_{SR}$  dobieramy w zależności od stosunku  $u_A/u_B$ . Z wykresu na rys. 3 [3] wynika, że dla  $u_A \le 0.1$   $u_B$   $k_{SR} = k_R = 1,645$ , a dla  $u_A \ge 10$   $u_B$   $k_{SR} = k_S = t_{0.95;\nu}$ . Dla pośrednich wartości  $u_A$  dobre przybliżenie daje sumowanie geometryczne niepewności standardowych typu A i B pomnożonych przez współczynniki rozszerzenia  $k_S$  i  $k_R$  (można je traktować jako (rozszerzone) niepewności typu A i B )

$$U(\bar{y}) \simeq \sqrt{[k_S u_A(\bar{y})]^2 + [k_R u_B(\bar{y})]^2} = \sqrt{U_A^2(\bar{y}) + U_B^2(\bar{y})}$$
(53)

2. Jeżeli wykonujemy serie po  $n_i$  pomiarów elementarnych dla N wielkości wejściowych (pomiar pośredni) i uwzględniamy zarówno niepewności standardowe typu A o rozkładzie t-Studenta, jak i typu B o rozkładzie prostokątnym, to stosujemy wzory

$$U(\bar{y}) = \sqrt{k_{\text{Swyp}}^2 \sum_{i=1}^{N} \left[ c_i u_A(\bar{x}_i) \right]^2 + k_{\text{Rwyp}}^2 \sum_{i=1}^{N} \left[ c_i u_B(\bar{x}_i) \right]^2}$$
 (54)

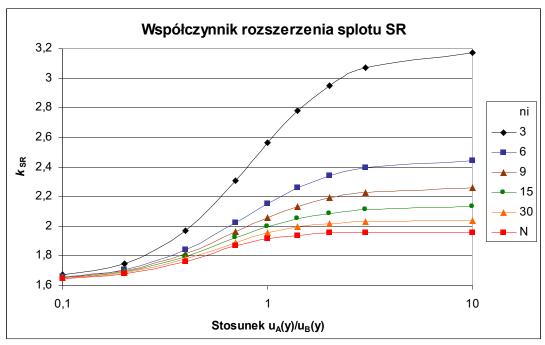
lub mniej dokładny

$$U(\bar{y}) = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} [k_S(v_i)c_i u_A(\bar{x}_i)]^2 + k_R^2 \sum_{i=1}^{N} [c_i u_B(\bar{x}_i)]^2}$$
 (55)

lub najmniej dokładny, z proponowanym przez "Guide" współczynnikiem k = 2

$$U(\bar{y}) = 2\sqrt{\sum_{i=1}^{N} \left[c_{i}u_{A}(\bar{x}_{i})\right]^{2} + \sum_{i=1}^{N} \left[c_{i}u_{B}(\bar{x}_{i})\right]^{2}} = 2\sqrt{\sum_{i=1}^{N} c_{i}^{2} \left[u_{A}^{2}(\bar{x}_{i}) + u_{B}^{2}(\bar{x}_{i})\right]}$$
(56)

Jeżeli w ostatnim wzorze udział niepewności typu A jest 10 razy mniejszy od udziału niepewności typu B, to zamiast współczynnika k = 2 lepiej zastosować współczynnik rozszerzenia dla rozkładów prostokątnych  $k_{2R}$ ,  $k_{3R}$  lub  $k_{Rwyp}$ . W pomiarach przemysłowych z reguły stosuje się ostatni wzór, gdyż zapewnia on wystarczającą dokładność.



Rys. 3. Współczynnik rozszerzenia splotu rozkładu Studenta i rozkładu prostokątnego [4].

# **Suplement C**

#### Obliczanie niepewności standardowej pomiaru wielkości wyjściowej

Zależność między wielkością wyjściową a wielkościami wejściowymi jest nazywana funkcją pomiaru

$$Y = f\left(X_1, X_2, \dots X_N\right) \tag{57}$$

Wartość oczekiwaną wielkości wyjściowej wyznacza się z funkcji pomiaru

$$\bar{y} = f(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots \bar{x}_N) \tag{58}$$

Błąd pomiaru  $\Delta Y$  wyznacza się z funkcji pomiaru przez rozwinięcie jej w szereg Taylora i uwzględnienie wyrazów z pochodnymi cząstkowymi pierwszego rzędu. Zakładamy, że w zakresie niewielkich wartości błędów funkcja pomiaru jest liniowa (w wypadku silnej nieliniowości funkcji pomiaru należy uwzględnić również składniki z pochodnymi wyższych rzędów [1]):

$$\Delta Y = \sum_{i=1}^{N} \frac{\partial Y}{\partial X_i} \Delta X_i = \sum_{i=1}^{N} c_i \Delta X_i$$
 (59)

gdzie  $c_i$  nosi nazwę **współczynnika wrażliwości**. Współczynnik ten pozwala przeliczyć niepewność standardową  $u(\bar{x}_i)$  danej wielkości wejściowej do wymiaru wielkości wyjściowej  $u_i(\bar{y})$ :

$$u_i(\bar{y}) = c_i u(\bar{x}_i) \tag{60}$$

W ten sposób, czyli stosując **prawo propagacji niepewności**, otrzymuje się poszczególne udziały niepewności wielkości wejściowych w niepewności wielkości wyjściowej. Suma geometryczna tych udziałów jest nazywana **niepewnością standardową pomiaru wielkości wyjściowej** (dawniej nazywana niepewnością złożoną wielkości wyjściowej)

$$u(\bar{y}) = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} u_i^2(\bar{y})} = \sqrt{c_1^2[u_A^2(\bar{x}_1) + u_B^2(\bar{x}_1)] + \dots + c_N^2[u_A^2(\bar{x}_N) + u_B^2(\bar{x}_N)]}$$
(61)

Powyższy wzór jest słuszny, jeżeli wielkości wejściowe są od siebie niezależne (nieskorelowane). W przeciwnym wypadku należy stosować wzory zawierające kowariancję lub współczynnik korelacji współzależnych wielkości wejściowych [3].

#### Literatura:

- 1. "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement" wyd. 2020 roku przez BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP i OIML
- 2. "Ewaluacja danych pomiarowych. Przewodnik wyrażania niepewności pomiaru" JCGM 100:2008 GUM 1995 wersja poprawiona https://www.gum.gov.pl/pl/aktualnosci/3285,Polskawersja-przewodnika-wyrazania-niepewnosci-pomiaru-juz-dostepna.html
- 3. Międzynarodowy słownik podstawowych terminów w metrologii International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology (ISO, 2007)
- 4. *Instrukcja do obróbki statystycznej wyników pomiarów* A. Hetman i J.M. Korczyński 2000 Politechnika Łódzka.